

Программа практического семинара по микроскопии, спектральному анализу и механическим испытаниям.

Тематика дня:

Новинки оборудования и методик в области материалогRAFических методов исследования материалов с использованием оборудования Struers, Olympus, Nanovea, Thermo Fisher Scientific.

Начало	Наименование доклада	Докладчик
08.30	Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк.	
09.00	Открытие семинара. Приветствие.	Анчевский Иван Эразмович Долгих Александр Евгеньевич
09.20	Оптические микроскопы Olympus (Япония): инновации для комфортной работы. Новый оптико-цифровой микроскоп DSX1000, инвертированный микроскоп GX-53. Метрологически точные исследования: лазерный конфокальный микроскоп LEXT OLS5000, измерительный микроскоп Olympus STM7.	Маринчук Артем Юрьевич
10.10	Кофе-брейк.	
10.25	Быстрое и точное определение неметаллических включений с помощью настольных электронных микроскопов Thermo Fisher Scientific (США).	Маринчук Артем Юрьевич
10.45	Применения электронных микроскопов Thermo Fisher Scientific (США). Компактный высокопроизводительный TEM Krios G4, характеристика материалов на атомарном уровне с ультра-сверхвысоким разрешением на TEM Spectra 300. Сверхбыстрая трёхмерная характеристика объектов с помощью лазерной приставки: Helios 5 Laser PFIB	Маринчук Артем Юрьевич
11.45	Оборудование для радиогRAFии и компьютерной томогRAFии NSI (США). Применение современных промышленных томогرافов на производстве. Индустрия 4.0. Новая высокоэнергетическая система MevX6. Автоматизация ROBOTIX.	Семенова Юлия Михайловна
12.45	Обед.	
13.30	Оборудование для пробоподготовки Struers (Дания). Решение любых задач: модульные настольные шлифовально-полировальные станки серии LaboSystem. Обновленные прецизионные отрезные станки Secotom. Новый напольный отрезной станок Axitom.	Маринчук Артем Юрьевич
14.00	Установки макротравления темплетов, автоматизация процесса травления.	Семенова Юлия Михайловна
14.15	<b>Доклад пользователя:</b> АО «Завод № 9». Опыт применения металлогRAFического оборудования Struers, Emco-Test на предприятии.	Водолазкина Елена Александровна
14.30	Кофе-брейк.	
14.45	<b>Мастер-класс:</b> «Определение неметаллических включений с помощью настольного электронного микроскопа Phenom» (длительность – 40 минут).	Маринчук Артем Юрьевич
14.45	Практическая работа на приборах (по предварительной записи).	
18.00	Завершение первого дня семинара.	

30.09.2020 г.

г. Екатеринбург

Программа практического семинара по микроскопии, спектральному анализу и механическим испытаниям.

Тематика дня:

Новинки оборудования и методик в области физико-механических испытаний материалов с использованием оборудования Emco-Test, Walter+Bai и Rumul.

Начало	Наименование доклада	Докладчик
08.30	Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк.	
09.00	Испытательная техника Walter+bai (Швейцария). Электродинамические испытательные машины для усталостных испытаний. LFV-16000-T – Специализированная сервогидравлическая испытательная система. LFV-E-10-ME – Электродинамическая испытательная машина для усталостных испытаний.	Долгих Александр Евгеньевич
10.30	Кофе-брейк.	
10.45	Резонансные системы Rumul (Швейцария). Бесконтактное измерение деформации при частоте 1000Гц. Резонансные пульсаторы с системой TRP для испытаний на К1С	Долгих Александр Евгеньевич
11.45	Комплексные решения для определения механических свойств поверхностей компании Nanovea (США). Новый трибометр T2000 с пневматической системой нагружения. Трибометр T100 с пневматической системой нагружения. Новый портативный профилометр JR100 – линейный оптический сенсор и моторизованные перемещения по всем осям.	Маринчук Артем Юрьевич
12.45	Обед	
13.45	Твердомеры EMCO-TEST (Австрия). Программное обеспечение для автоматизации измерений.	Долгих Александр Евгеньевич
14.30	<b>Доклад пользователя:</b> ИМАШ УрО РАН. Материалы нового поколения: от идеи до реализации. Опыт применения высокочастотной системы Testronic/Mikrotron.	Каманцев Иван Сергеевич
14.45	<b>Мастер-класс:</b> Измерения азотированного/цементированного слоя и глубины поверхностной закалки на микротвердомере DuraScan 20 G5 (длительность – 40 минут).	Маринчук Артем Юрьевич
14.45	Практическая работа на приборах (по предварительной записи).	
18.00	Завершение второго дня семинара.	

01.10.2020 г.

г. Екатеринбург

Программа практического семинара по микроскопии, спектральному анализу и механическим испытаниям.

Тематика дня:

Новинки оборудования и методик в области химического и структурного анализа материалов производства Bruker.

Начало	Наименование доклада	Докладчик
08.30	Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк.	
09.00	Применение оптико-эмиссионных спектрометров Bruker для решения задач аналитического контроля на современном предприятии. Новые возможности Q4 TASMAN. Станки для подготовки проб MDG.	Семенова Юлия Михайловна
09.40	Технологический контроль газов и легких элементов в твердых материалах. Анализаторы компании Bruker. Новые анализаторы ONH: G8 GALILEO с масс-спектрометрическим детектором и G6 LEONARDO.	Ахметов Марат Фанильевич
10.10	Применение новых ИК-Фурье спектрометра INVENIO X и ИК-микроскоп LUMOS II компании Bruker для контроля полимерных материалов.	Ахметов Марат Фанильевич
11.10	Кофе-брейк.	
11.25	Применение портативных РФА спектрометров для входного и технологического контроля на предприятии. Новые решения Bruker с помощью спектрометров S1 TITAN, Tracer 5, СТХ.	Семенова Юлия Михайловна
12.05	<b>Доклад пользователя:</b> АО «Челябинский цинковый завод». Опыт применения оптико-эмиссионного спектрометра Q8 MAGELLAN на производстве. Решение специализированных задач на рентгенофлуоресцентном спектрометре S2 PUMA.	Ковалев Евгений Валерьевич
12.20	Обед.	
13.20	Элементный анализ рентгенофлуоресцентным методом. Обновленный модельный ряд спектрометров Bruker. S2 PUMA Series 2, S2 POLAR.	Головков Анатолий Викторович
13.55	Новые лидеры линейки дифрактометров компании Bruker – исследовательский D8 DISCOVER Plus и промышленный D8 ENDEAVOR	Ахметов Марат Фанильевич
14.20	Кофе-брейк.	
14.35	Новинки Analytic Jena (Германия) для элементного анализа: оптико-эмиссионные и масс-спектрометры с индуктивно связанной плазмой серии Plasma Quant, атомно-абсорбционный спектрометр novAA 800, спектрофотометры Specord.	Ахметов Марат Фанильевич
15.10	<b>Мастер-класс:</b> Анализ проволоки, пластин и образцов нестандартной формы на оптико-эмиссионном спектрометре Q4Tasman (длительность – 40 минут).	Семенова Юлия Михайловна
15.10	Практическая работа на приборах (по предварительной записи).	
18.00	Завершение семинара.	

**Практическая работа на приборах:**

1. Искровой оптико-эмиссионный спектрометр Q4 TASMAN (Bruker).
2. Портативный рентгенофлуоресцентный спектрометр - S1 Titan (Bruker).
3. Рентгенофлуоресцентный спектрометр S2 PUMA (Bruker).
4. Настольный дифрактометр D2 Phaser (Bruker).
5. Оптико-эмиссионный спектрометр Q4 Mobile (Bruker).
6. ИК-спектрометр ALPHA II (Bruker).
7. Инвертированный металлографический микроскоп GX53 (Olympus).
8. Сканирующий микроскоп Phenom (Thermo Fisher Scientific).
9. Испытательная машина LFM (Walter+Bai).
10. Микротвердомер - DuraScan 20 (Emco-Test).
11. Шлифовально-полировальный станок - Tegamin (Struers).

Индивидуальная работа на приборах по предварительной записи при регистрации.  
Рекомендованное количество образцов для анализа не более 2-х.

Если у Вас есть вопросы или пожелания к содержанию семинара, докладчикам,  
просим обращаться к Ковалевой Дарье по телефону: +7 (343) 287-12-85  
или по e-mail: infoural@melytec.ru.